

## 权利要求书

1. 一种测试电路，包括：

信号处理模块，用于接收待测试的脉冲信号，并在控制信号的控制下输出处理信号；

5        采样模块，与所述信号处理模块的输出端连接，用于接收所述处理信号，并根据所述处理信号生成采样信号；

其中，所述采样信号包括第一采样脉冲和第二采样脉冲，所述第一采样脉冲和所述第二采样脉冲具有一脉冲宽度差，所述脉冲宽度差等于所述脉冲信号的脉冲宽度。

10       2. 根据权利要求 1 所述的测试电路，其中，所述采样模块包括：

第一暂存单元，所述第一暂存单元的时钟驱动端与所述信号处理模块连接，所述第一暂存单元用于响应所述处理信号对待采样信号进行采样，以生成第一暂存信号，所述采样信号的边沿与所述第一暂存信号的边沿相对应。

15       3. 根据权利要求 2 所述的测试电路，其中，所述第一暂存单元包括触发器、锁存器、寄存器中的一种或多种。

4. 根据权利要求 2 所述的测试电路，其中，所述采样模块还包括：

第一反相器，与所述第一暂存单元共同构成反馈环路，所述反馈环路用于响应所述处理信号生成反馈信号，所述反馈信号的边沿与所述处理信号的边沿相对应。

20       5. 根据权利要求 4 所述的测试电路，其中，所述第一反相器的输入端与所述第一暂存单元的输出端连接，所述第一反相器的输出端与所述第一暂存单元的输入端连接，所述第一反相器用于对所述第一暂存信号进行反相，以生成反馈信号。

6. 根据权利要求 5 所述的测试电路, 其中, 所述采样模块还包括:

第二反相器, 所述第二反相器的输入端与所述第一反相器的输出端连接, 所述  
第二反相器用于接收所述反馈信号, 并根据所述反馈信号生成所述采样信号。

7. 根据权利要求 1 所述的测试电路, 其中, 所述脉冲信号包括时序上相邻  
5 的四个脉冲, 所述信号处理模块用于响应所述控制信号, 对所述脉冲信号中时序  
上的首个所述脉冲进行反相, 并对其余所述脉冲不进行反相;

其中, 所述采样模块用于响应时序上的前两个所述脉冲生成所述第一采样  
脉冲, 并响应时序上的后两个所述脉冲生成所述第二采样脉冲。

8. 根据权利要求 7 所述的测试电路, 其中, 所述采样模块用于响应时序上  
10 的前两个所述脉冲的相同边沿生成所述第一采样脉冲, 并响应时序上的后两个  
所述脉冲的不同边沿生成所述第二采样脉冲。

9. 根据权利要求 1 所述的测试电路, 其中, 还包括:

控制模块, 分别与所述采样模块和所述信号处理模块连接, 用于响应所述采  
样信号生成所述控制信号, 所述控制信号的边沿与所述采样信号的边沿相对应。

15 10. 根据权利要求 9 所述的测试电路, 其中, 所述控制模块包括:

第二暂存单元, 所述第二暂存单元的时钟驱动端与所述采样模块的输出端  
连接, 所述第二暂存单元的输入端与预设电平信号连接, 所述第二暂存单元的输  
出端与所述信号处理模块连接, 所述第二暂存单元用于响应所述采样信号对预  
设电平信号进行采样, 以生成第二暂存信号, 所述控制信号的边沿与所述第二暂  
20 存信号的边沿相对应。

11. 根据权利要求 10 所述的测试电路, 其中, 所述控制模块还包括:

第三反相器, 所述第三反相器的输入端与所述第二暂存单元的输出端连接,  
所述第三反相器用于接收所述第二暂存信号, 并根据所述第二暂存信号生成所

述控制信号。

12. 一种测试装置，包括：

如权利要求 1 至 11 任一项所述的测试电路；

分析模块，与所述采样模块连接，用于根据所述第一采样脉冲和所述第二采样脉冲获取所述脉冲信号中所述脉冲的宽度。

13. 一种测试方法，基于如权利要求 12 所述的测试装置，所述方法包括：

接收待测试的脉冲信号；

在控制信号的控制下输出处理信号；

根据所述处理信号生成采样信号，所述采样信号包括第一采样脉冲和第二采样脉冲；

根据所述第一采样脉冲和所述第二采样脉冲获取所述脉冲信号中所述脉冲的宽度；

其中，所述第一采样脉冲和所述第二采样脉冲具有一脉冲宽度差，所述脉冲宽度差等于所述脉冲信号的脉冲宽度。